

Title (en)

Test method for light diodes

Title (de)

Testverfahren für Leuchtdioden

Title (fr)

Procédé de test pour diodes luminescentes

Publication

**EP 2197243 A1 20100616 (DE)**

Application

**EP 08021177 A 20081205**

Priority

EP 08021177 A 20081205

Abstract (en)

The method involves operating light emitting diodes (1 to 5) in a normal operating mode with a pulse width modulated current signal and interrupting the normal operating mode. A short-circuit measurement is executed on only light emitting diode during the interruption of the normal operating mode.

Abstract (de)

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Testen der Funktionstüchtigkeit einer Anzahl an über eine gemeinsame Steuerung betriebener LEDs, welche vorzugsweise in Gruppen, insbesondere in LED-Streifen oder -Leisten organisiert sind. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden die LEDs in einem Normalbetriebsmodus mit einem pulswertenmodulierten Stromsignal betrieben, welches zur Durchführung einer Kurzschlussmessung an weniger als allen LEDs unterbrochen wird, bevor anschließend der Normalbetriebsmodus wieder fortgesetzt wird.

IPC 8 full level

**H05B 44/00** (2022.01); **H05B 45/50** (2022.01); **H05B 45/59** (2022.01)

CPC (source: EP US)

**H05B 45/50** (2020.01 - EP US); **H05B 45/59** (2022.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] GB 2434929 A 20070808 - LEAR CORP [US]
- [A] US 2007170876 A1 20070726 - ITO MASAYASU [JP], et al
- [A] US 2005062481 A1 20050324 - VAUGHN THOMAS [US], et al
- [A] US 2004201496 A1 20041014 - HERING BERNHARD [DE], et al

Cited by

DE102012101363A1; US9295118B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)

**EP 2197243 A1 20100616**

DOCDB simple family (application)

**EP 08021177 A 20081205**